

JIS 見直し及び JIS 確認の申出に係る審議について

日本産業規格（以下、JIS という。）は、産業標準化法に基づき、JIS を制定又は確認若しくは改正した日から少なくとも 5 年を経過するまでに見直す必要があります。多数の JIS があることから効率的な運用のために、毎年度一括して JIS 見直しを行うこととしております。JIS の見直しの流れ及び産業標準作成委員会の審議方法は、別添 1 をご参照ください。

なお、別添 1 のとおり「JIS 作成予定一覧表の公表」、「利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保」及び「異議申立ての機会の確保及び廃止のみ意見受付公告」の過程で、利害関係者から意見等があった場合で、議決結果の変更又は意見等を採用しない場合は、再度、産業標準作成委員会にお諮りいたします。また、字句等編集上の修正については、事務局に一任いただきますようお願いいたします。

（１）JIS 見直しの審議

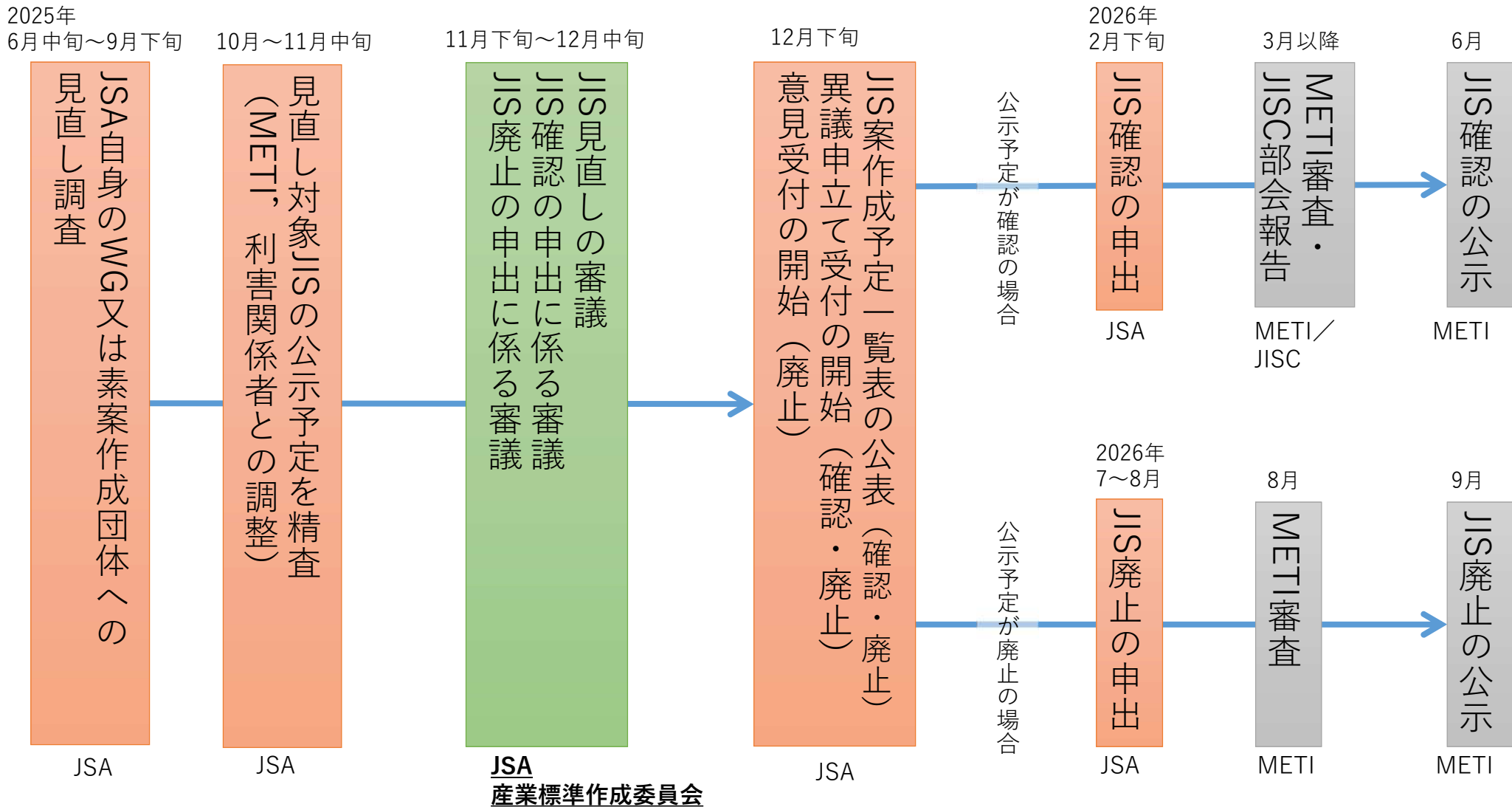
2026 年度に見直し期限を迎える JIS について、当会にて関係各方面の意見を十分に調査し、別添 2 のとおり 2026 年度中に改正、確認又は廃止とするかの案を作成いたしましたので、ご審議をお願いいたします。ご承認いただいた JIS 見直しのうち、公示予定が「確認」、及び公示予定が「廃止」、かつ、これから廃止に着手する JIS については、その内容を利害関係者に公表するために JIS 作成予定一覧表として JSA ホームページに掲載いたします。

（２）JIS 確認の申出の審議

上記別添 2 に基づき、別添 3【確認の作成審議経過報告書】に、2026 年度中の公示予定を「確認」とする JIS 及び作成審議経過等を作成いたしました。申出前までに利害関係者からのご意見等がない場合は、公示予定が「確認」について、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、主務大臣に申出してよろしいか、あわせてご審議をお願いいたします。

以上

別添1：JISの見直しに関する審議 (1) JIS見直しの流れ



(2) JIS見直しの審議について

目的： 次年度に5年見直し期限を迎えるJISについて、「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの見直し方針を決定します。

1. 利害関係者の意見を確認するため、JSAが見直し対象のJISを抽出し、調査します。
 - ※ 見直し対象は、次年度に5年見直し期限を迎えるJISです。
 - ※ 技術的動向、対応国際規格や引用規格の改正・廃止などを背景に、JISを改正する必要があるのか、確認でよいのか、又は廃止するかなどを調査します。

(2) JIS見直しの審議について（続き）

2. JSAが調査結果に基づき、それぞれのJISについて「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの案（以下、JIS見直し案という。）を理由とともに作成します。

その際には、必要に応じて、JSA自身のWG又は素案作成団体に事実確認を行います。

その後、産業標準作成委員会にお諮りします。

※ 当該JISが次に該当し、次年度までに「改正」又は「廃止」の公示を予定している場合は、JIS見直し案を「改正」又は「廃止」とします。

※ 当該JISが次に該当し、これから改正又は廃止に着手するため、次年度までに「改正」若しくは「廃止」の公示ができない場合、又は次に該当しない場合は、JIS見直し案を「確認」とします。

改正又は廃止が必要な要因
市場実態又は技術動向に合わせ、最適な技術内容とすべく、規定内容の変更が必要
社会的要因で規定内容の変更が必要（環境問題など）
対応国際規格の改正又は廃止があり、規定内容の変更が必要
対応すべき国際規格が新たに制定され、それに整合することが必要
引用規格の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
引用すべきJISが新たに制定された
引用（参照）法規の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
引用（参照）すべき法規が新たに制定された
技術の陳腐化・利用の縮小等、JISの廃止が妥当

(2) JIS見直しの審議について (続き)

3. 産業標準作成委員会でJIS見直し案をご審議いただきます。

JIS見直し案：【別添2】

- ※ JIS見直し案の資料については、JSAで事実確認を行っております。
- ※ 対応国際規格などの改廃状況は、資料の参照文書（JSA調査結果）に記載しております。
- ※ ご承認いただいたJIS見直しのうち、公示予定が「確認」及び「廃止」のJISは、JIS作成予定一覧表としてJSAホームページに掲載します。
(利害関係者に対する産業標準作成委員会への参加の機会の確保及び異議申立ての機会の確保のため)

(3) JIS確認及び廃止の申出に係る審議

目的： 利害関係者の意向を適切に反映するためのプロセスを通し、
主務大臣にJISの確認及び廃止の申出をしてよいかどうかを決定します。

※廃止方針JISのない分野の産業標準作成委員会では「JIS確認の申出」のみ審議します。
また、その場合は、2. の【別添4】 もございません。

1. JIS見直しの審議と同時に、JSAが作成審議経過報告書（確認及び廃止）（案）を作成します。

※ 当該報告書では、確認及び廃止の申出を行う対象JIS、確認及び廃止する理由、認定機関としてのプロセスの予定（JIS見直しの審議～JIS作成予定一覧表の公表結果（確認及び廃止）（予定）、並びに意見受付公告結果（廃止）（予定））を示しております。

2. 産業標準作成委員会で作成審議経過報告書（確認及び廃止）（案）に基づき、ご審議いただきます。

作成審議経過報告書：確認【別添3】、廃止【別添4】

3. 審議後、JIS作成予定一覧表の公表（確認及び廃止）及び意見受付公告（廃止）によって、利害関係者の意向を確認します。

※ これによって利害関係者から意見等があった場合で、議決結果の変更又は意見等を採用しない場合は、再度、産業標準作成委員会にお諮りいたします。
ただし、意見の提出がない、又は審議の結果に影響を与えない場合は
4. 申出へと進みます。

4. 産業標準作成委員会で承認されたJISは、JSAから主務大臣へJISの確認及び廃止の申出を行います。

2026年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案) (基本分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、 廃止又は“一” を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS B 0028:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—寸法及び公差の表示方式—円すい	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	1: IDT		無
JIS B 0031:2022	製品の幾何特性仕様(GPS)—表面性状の図示方法	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 0634:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—フィルタ処理—線形の輪郭曲線フィルタ:ガウシアンフィルタ	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	1: IDT		無
JIS B 0641-5:2021	製品の幾何特性仕様(GPS)—製品及び測定装置の測定による検査—第5部:指示測定器の適合性検査における不確かさ	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 0642:2022	製品の幾何特性仕様(GPS)—測定機器の一般的な概念及び要求事項	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 0670:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)—表面性状:輪郭曲線方式—針針式表面粗さ測定機の校正	確認	改正を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、改正公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 0671-1:2022	製品の幾何特性仕様(GPS)—表面性状:輪郭曲線方式:プラト—構造表面の特性評価—第1部:フィルタ処理及び測定条件	確認	対応国際規格の改訂内容が軽微であり、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 0671-2:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)—表面性状:輪郭曲線方式:プラト—構造表面の特性評価—第2部:線形表現の負荷曲線による高さの特性評価	確認	廃止を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、廃止公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	1: IDT		無
JIS B 0671-3:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)—表面性状:輪郭曲線方式:プラト—構造表面の特性評価—第3部:正規確率紙上の負荷曲線による高さの特性評価	確認	廃止を検討中だが、当該規格に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するための調整等に時間が必要であり、廃止公示となるのが再来年度以降となる見込みのため、確認とする。	1: IDT		無
JIS B 0682-1:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—真円度—第1部:用語及びパラメータ	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 0682-2:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—真円度—第2部:仕様オペレータ	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 0683-1:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—真直度—第1部:用語及びパラメータ	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 0683-2:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—真直度—第2部:仕様オペレータ	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 7440-5:2022	製品の幾何特性仕様(GPS)—座標測定システム(CMS)の受入検査及び定期検査—第5部:シングル及びマルチスタイル接触プロービングシステムを用いた離散点及びスキミング測定	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		無
JIS B 7440-9:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—座標測定システム(CMS)の受入検査及び定期検査—第9部:マルチセンサシステム付き座標測定機	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		無
JIS B 7751:2007	紫外線カーボンアーク灯式の耐光性試験機及び耐候性試験機	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 日本試験機工業会
JIS B 7753:2007	サンシャインカーボンアーク灯式の耐光性試験機及び耐候性試験機	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 日本試験機工業会
JIS B 7754:1991	キセノンアークランプ式耐光性及び耐候性試験機	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 日本試験機工業会
JIS B 7755:2011	金属用シャルピー振り子式衝撃試験—計装化装置	改正	対応国際規格が改訂されているとともに、技術的な環境変化が生じているため、改正する。	1: IDT		一般社団法人 日本試験機工業会
JIS B 7757:1995	強制循環式空気加熱老化試験機	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 日本試験機工業会
JIS B 7758:2016	動電式振動試験装置—性能特性	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	2: MOD		一般社団法人 日本試験機工業会

【JIS書誌情報】

書誌情報				参照文書 (JISA調査結果)		
規格番号及び 西暦年	最新 公示		主務 大臣	専門 委員会	対応 国際 規格	引用 JIS
	種類	年月日				
JIS B 0028:2017	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	×	×
JIS B 0031:2022	改正	2022/3/22	経産	基盤技術	×	×
JIS B 0634:2017	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	×	×
JIS B 0641-5:2021	制定	2021/10/20	経産	基盤技術	◎	×
JIS B 0642:2022	改正	2022/3/22	経産	基盤技術	◎	◎
JIS B 0670:2002	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	×	×
JIS B 0671-1:2022	改正	2022/3/22	経産	基盤技術	×	×
JIS B 0671-2:2002	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	×	×
JIS B 0671-3:2002	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	×	×
JIS B 0682-1:2017	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	◎	◎
JIS B 0682-2:2017	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	◎	×
JIS B 0683-1:2017	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	◎	◎
JIS B 0683-2:2017	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	◎	×
JIS B 7440-5:2022	改正	2022/3/22	経産	基盤技術	◎	◎
JIS B 7440-9:2017	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	◎	×
JIS B 7751:2007	確認	2021/10/20	経産	基盤技術	-	×
JIS B 7753:2007	確認	2021/10/20	経産	基盤技術	-	×
JIS B 7754:1991	確認	2021/10/20	経産	基盤技術	-	×
JIS B 7755:2011	確認	2021/10/20	経産	基盤技術	×	×
JIS B 7757:1995	確認	2021/10/20	経産	基盤技術	-	×
JIS B 7758:2016	確認	2021/10/20	経産	基盤技術	×	◎

参照文書の記号の説明:
◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、
存続している。
× 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、
改定及び/又は廃止されている(現状が不明なもの含む)。
- 当該JISに参照文書がない。

対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日
ISO 3040:2009	IDT	2000/3/20	2017/02/20
ISO 1302:2002	MOD	1982/6/15	2022/03/22
ISO 16610-21:2011	IDT	2017/1/20	
ISO 14253-5:2015	MOD	2021/10/20	
ISO 14978:2018	MOD	2010/9/21	2022/03/22
ISO 12179:2000	MOD	2002/3/20	
ISO 13565-1:1996	MOD	2002/3/20	2022/03/22
ISO 13565-2:1996	IDT	2002/3/20	
ISO 13565-3:1998	IDT	2002/3/20	
ISO 12181-1:2011	MOD	2017/2/20	
ISO 12181-2:2011	MOD	2017/2/20	
ISO 12780-1:2011	MOD	2017/2/20	
ISO 12780-2:2011	MOD	2017/2/20	
ISO 10360-5:2020	MOD	2004/3/20	2022/03/22
ISO 10360-9:2013	IDT	2017/2/20	
		1974/9/1	2007/02/20
		1977/6/1	2007/02/20
		1979/1/1	1991/03/01
ISO 14556:2000	IDT	1993/10/1	2011/04/20
		1995/12/1	
ISO 5344:2004	MOD	1995/12/1	2016/08/22

2026年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案) (基本分野)

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、 廃止又は“一” を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 1613:2007	メタルハライドランプ方式試験機用高エネルギー紫外放射照度計	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 日本試験機工業会
JIS Z 8206:1982	工程図記号	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	6: 無(提未)対応国際規格が存在せず、今後の対応未定のもの。		無
JIS Z 8222-2:2006	製品技術文書に用いる図記号のデザイン—第2部:参照ライブラリ用図記号を含む電子化形式の図記号の仕様、及びその相互交換の要求事項	確認	対応国際規格の改訂内容が軽微であり、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		無
JIS Z 8222-3:2006	製品技術文書に用いる図記号のデザイン—第3部:接続ノード、ネットワーク及びそのコード化の分類	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		無
JIS Z 8245-1:2006	技術文書マネジメント—第1部:原則及び方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		無
JIS Z 8402-5:2002	測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)—第5部:標準測定方法の精度を求めるための代替法	確認	技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。ただし、対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて改正の要否を検討する予定。	1: IDT		無
JIS Z 8403:1996	製品の品質特性—規格値の決め方通則	確認	(対応国際規格は存在せず)技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		無
JIS Z 8405:2021	試験所間比較による技能試験に使用する統計的方法	確認	技術的な環境変化が生じていないため、確認とする。ただし、対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて改正の要否を検討する予定。	1: IDT		無
JIS Z 8462-4:2006	測定方法の検出能力—第4部:与えられた値が検出可能か否かの判定方法	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		無
JIS Z 8462-5:2011	測定方法の検出能力—第5部:検量線が線形及び非線形である場合の方法	確認	対応国際規格の改訂内容が軽微であり、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		無
JIS Z 9020-1:2016	管理図—第1部:一般指針	確認	対応国際規格の改訂内容が軽微であり、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		無
JIS Z 9061:2016	新技術及び新製品開発プロセスのための統計的方法の応用—ロバストパラメータ設計(RPD)	確認	対応国際規格が改訂等されていないとともに、技術的な環境変化も生じていないため、確認とする。	1: IDT		無

別添2

【JIS書誌情報】

書 誌 情 報					参 照 文 書 (JSA調査結果)		
規格番号及び 西暦年	最新 公 示		主 務 大 臣	専 門 委 員 会	対 応 国 際 規 格	引 用 JIS	引 用 国 際 規 格
	種 別	年 月 日					
JIS C 1613:2007	確認	2021/10/20	経産	基盤技術	-	×	-
JIS Z 8206:1982	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	-	-	-
JIS Z 8222-2:2006	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	×	×	×
JIS Z 8222-3:2006	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	◎	-	-
JIS Z 8245-1:2006	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	◎	×	×
JIS Z 8402-5:2002	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	×	×	-
JIS Z 8403:1996	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	-	×	-
JIS Z 8405:2021	改正	2021/4/20	経産	基盤技術	×	×	◎
JIS Z 8462-4:2006	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	◎	×	◎
JIS Z 8462-5:2011	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	×	×	-
JIS Z 9020-1:2016	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	×	◎	-
JIS Z 9061:2016	確認	2021/6/21	経産	基盤技術	◎	◎	◎

参照文書の記号の説明：
◎ 当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、
存続している。
× 当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、
改定及び/又は廃止されている（現状が不明なものを含む）。
－ 当該JISに参照文書がない。

対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日
		2007/2/20	
		1960/1/1	1982/03/01
IEC 81714-2:1998	IDT	2006/11/20	
IEC 81714-3:2004	IDT	2006/11/20	
IEC 82045-1:2001	IDT	2006/11/20	
ISO 5725-5:1998	IDT	2002/7/20	
		1996/8/1	
ISO 13528:2015	IDT	2008/1/20	2021/04/20
ISO 11843-4:2003	IDT	2006/11/20	
ISO 11843-5:2008	IDT	2011/8/22	
ISO 7870-1:2014	IDT	2011/1/20	2016/12/20
ISO 16336:2014	IDT	2016/12/20	

日本産業規格作成審議経過報告書（確認）

1. 確認の申出を行う日本産業規格

JIS B 0028 製品の幾何特性仕様（GPS）—寸法及び公差の表示方式—円すい 外 31 件（別紙 1 のとおり）

2. 確認の申出を行う日本産業規格に係る主務大臣

経済産業大臣専管

3. 確認の理由

別紙 1 の日本産業規格は、産業標準化法第 17 条の規定による見直し期限を 2026 年度に迎えるものであるが、認定産業標準作成機関として、関係各方面の意見を調査し検討した結果、現行の日本産業規格がなお適正であると認められることから、確認すべきものとして申出する。

4. 確認の申出を行う日本産業規格の作成及び審議に関する事項

(1) 認定産業標準作成機関名；一般財団法人日本規格協会（JSA）

(2) 法令上の区分；

産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項に基づく申出

(3) 産業標準作成委員会名；

基本分野産業標準作成委員会

(4) 産業標準作成委員会の委員構成表及び開催状況；

別紙 2 に記載のとおり。

(5) 作成審議経過

別紙 2 に記載のとおり。

以上

確認の申出を行う日本産業規格

No.	規格番号	規格名称
1	B0028	製品の幾何特性仕様（GPS）—寸法及び公差の表示方式—円すい
2	B0031	製品の幾何特性仕様（GPS）—表面性状の図示方法
3	B0634	製品の幾何特性仕様（GPS）—フィルタ処理—線形の輪郭曲線フィルタ：ガウシアンフィルタ
4	B0641-5	製品の幾何特性仕様（GPS）—製品及び測定装置の測定による検査—第5部：指示測定器の適合性検査における不確かさ
5	B0642	製品の幾何特性仕様（GPS）—測定機器の一般的な概念及び要求事項
6	B0670	製品の幾何特性仕様（GPS）—表面性状：輪郭曲線方式—触針式表面粗さ測定機の校正
7	B0671-1	製品の幾何特性仕様（GPS）—表面性状：輪郭曲線方式；プラトー構造表面の特性評価—第1部：フィルタ処理及び測定条件
8	B0671-2	製品の幾何特性仕様（GPS）—表面性状：輪郭曲線方式；プラトー構造表面の特性評価—第2部：線形表現の負荷曲線による高さの特性評価
9	B0671-3	製品の幾何特性仕様（GPS）—表面性状：輪郭曲線方式；プラトー構造表面の特性評価—第3部：正規確率紙上の負荷曲線による高さの特性評価
10	B0682-1	製品の幾何特性仕様（GPS）—真円度—第1部：用語及びパラメータ
11	B0682-2	製品の幾何特性仕様（GPS）—真円度—第2部：仕様オペレータ
12	B0683-1	製品の幾何特性仕様（GPS）—真直度—第1部：用語及びパラメータ
13	B0683-2	製品の幾何特性仕様（GPS）—真直度—第2部：仕様オペレータ
14	B7440-5	製品の幾何特性仕様（GPS）—座標測定システム（CMS）の受入検査及び定期検査—第5部：シングル及びマルチスタイラス接触プロービングシステムを用いた離散点及びスキニング測定
15	B7440-9	製品の幾何特性仕様（GPS）—座標測定システム（CMS）の受入検査及び定期検査—第9部：マルチセンサシステム付き座標測定機
16	B7751	紫外線カーボンアーク灯式の耐光性試験機及び耐候性試験機
17	B7753	サンシャインカーボンアーク灯式の耐光性試験機及び耐候性試験機
18	B7754	キセノンアークランプ式耐光性及び耐候性試験機
19	B7757	強制循環式空気加熱老化試験機
20	B7758	動電式振動試験装置—性能特性
21	C1613	メタルハライドランプ方式試験機用高エネルギー紫外放射照度計
22	Z8206	工程図記号
23	Z8222-2	製品技術文書に用いる図記号のデザイン—第2部：参照ライブラリ用図記号を含む電子化形式の図記号の仕様、及びその相互交換の要求事項
24	Z8222-3	製品技術文書に用いる図記号のデザイン—第3部：接続ノード、ネットワーク及びそのコード化の分類
25	Z8245-1	技術文書マネジメント—第1部：原則及び方法
26	Z8402-5	測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）—第5部：標準測定方法の精度を求めるための代替法
27	Z8403	製品の品質特性—規格値の決め方通則
28	Z8405	試験所間比較による技能試験に使用する統計的方法
29	Z8462-4	測定方法の検出能力—第4部：与えられた値が検出可能か否かの判定方法
30	Z8462-5	測定方法の検出能力—第5部：検量線が線形及び非線形である場合の方法
31	Z9020-1	管理図—第1部：一般指針

32	Z9061	新技術及び新製品開発プロセスのための統計的方法の応用—ロバスト パラメータ設計（R P D）
----	-------	---

1. 産業標準作成委員会の委員構成表

1. 1 基本分野産業標準作成委員会

	氏名	所属	種別
(委員長)	山本 浩	埼玉大学	中立者
(委員)	上原 実	一般社団法人日本産業機械工業会	
	大谷 幸利	宇都宮大学	
	橘田 淳一郎	一般財団法人日本品質保証機構	
	越川 哲哉	一般社団法人日本鉄鋼連盟	
	小林 信治	一般財団法人日本色彩研究所	
	鈴木 伸哉	関東学院大学	
	百武 健一郎	一般財団法人化学物質評価研究機構	
	安井 清一	東京理科大学	
	綿貫 宏樹	一般社団法人日本電機工業会	
(関係者)	原 和秀	経済産業省イノベーション・環境局国際標準課	—
(事務局)	鐘築 利仁	一般財団法人日本規格協会	
	江本 秀司	一般財団法人日本規格協会	

2. 委員会開催状況

開催年月日	委員会区分	出席者数又は回答者数（名）
2025年12月●日（予定）	産業標準作成委員会	●/●

3. 作成審議経過（予定）

- ①産業標準案作成対象テーマの審議（JIS 見直しの審議）、並びに
産業標準案の作成及び審議（確認の申出に係る審議）；

2025 年 12 月●日 産業標準作成委員会議決

- ②JIS 作成予定一覧表の公表；

2025 年 12 月●日～申出予定日（2026 年 2 月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載

- ③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保；

2025 年 12 月●日～申出予定日（2026 年 2 月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載

- ④異議申立ての機会の確保；

2025 年 12 月●日～申出予定日（2026 年 2 月下旬）まで JSA ウェブサイト掲載

- ⑤議事録及び委員会資料の公開；

2025 年 12 月●日 JSA ウェブサイト掲載

4. 利害関係者の産業標準作成委員会への参加に関する内容（予定）

参加： 無

5. 異議申立てに関する内容及び結果（予定）

異議申立ての有無： 無